(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 9. März 2006 (09.03.2006)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer **WO 2006/024279**

- (51) Internationale Patentklassifikation: G02B 21/26 (2006.01) G02B 21/36 (2006.01)
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2005/001516
- (22) Internationales Anmeldedatum:

30. August 2005 (30.08.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 10 2004 042 913.8

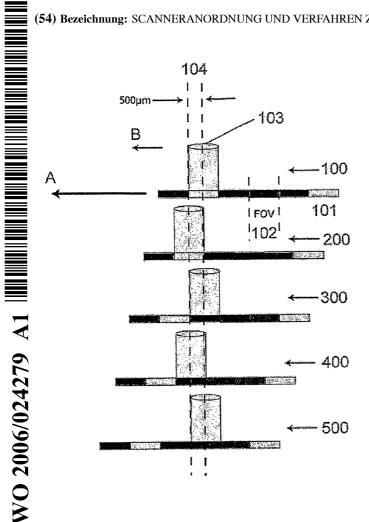
2. September 2004 (02.09.2004)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVER-SITÄT MÜNSTER [DE/DE]; Schlossplatz 2, 48149 Münster (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FREKERS, Dieter [DE/DE]; Augustin-Wibbelt-Strasse 16, 48341 Altenberge (DE). WACHSMANN, Christian [DE/DE]; Fresnostr. 141, 48159 Münster (DE). AKSIT, Ishak [DE/DE]; Grevenerstr. 165/167, 48159 Münster (DE).
- (74) Anwalt: VIERING, Hans-Martin; Viering, Jentschura & Partner, Steinsdorfstr. 6, 80538 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: SCANNER ARRANGEMENT AND METHOD FOR OPTICALLY SCANNING AN OBJECT
- (54) Bezeichnung: SCANNERANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM OPTISCHEN ABTASTEN EINES OBJEKTS



- (57) Abstract: Disclosed is a scanner arrangement (50), especially a scanning microscope, for optically scanning an object (101) in a series of scanning steps. Said scanner arrangement comprises a driven, movable object table (40) and a scanner objective (4, 7-10) that is provided with a front objective lens (9, 103) located on an objective lens carriage (8) which can be moved parallel to the object table (40) by a carriage drive (5, 6, 10, 11). The object table (40) can be driven so as to be moved continuously during the series of scanning steps. The objective lens carriage (8) encompassing the front objective lens (9, 103) can be driven for a preliminary movement step in which the front objective lens (9, 103) is moved in synchrony with the object table (40) from a neutral position in each of the scanning steps while being driven so as to be moved back into the neutral position between successive scanning steps, the object (101) being optically scanned during the continuous movement of the object table (40).
- (57) Zusammenfassung: Eine Scanneranordnung (50), insbesondere ein Scanning-Mikroskop, zum optischen Abtasten eines Objekts (101) in einer Folge von Abtastschritten, weist auf: einen antreibbaren, bewegbaren Objekttisch (40) und ein Scannerobjektiv (4, 7-10), welches eine Frontobjektivlinse (9, 103) an einem Objektivlinsenschlitten (8) aufweist, welcher von einem Schlittenantrieb (5, 6, 10, 11) parallel zu dem Objekttisch (40) bewegbar ist, wobei der Objekttisch (40) für eine durchgehend kontinuierliche Bewegung während der Folge von Abtastschritten antreibbar ist und der Objektivlinsenschlitten (8) mit der Frontobjektivlinse (9, 103) in jedem der Abtastschritte

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2006/024279 A1



SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\u00fcr \u00e4nderungen der Anspr\u00fcche geltenden Frist; Ver\u00f6ffentlichung wird wiederholt, falls \u00e4nderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

für einen Vorbewegungsschritt, in welchem die Frontobjektivlinse (9, 103) aus einer Ausgangsstellung heraus synchron mit dem Objektivtisch (40) mitbewegt wird, und jeweils zwischen aufeinander folgenden Abtastschritten für eine Rückbewegung in die Ausgangsstellung antreibbar ist, wobei das optische Abtasten des Objekts (101) während der kontinuierlichen Bewegung des Objekttischs (40) durchführbar ist.

PCT/DE2005/001516

1

Scanneranordnung und Verfahren zum optischen Abtasten eines Objekts

Die Erfindung betrifft eine Scanneranordnung und ein 5 Verfahren zum optischen Abtasten eines Objekts.

Im Bereich Medizin, Biophysik, Biologie, Pharmakologie, Materialkontrolle und Bildarchivierung histologischer Präparate werden optische Abtastmikroskope (Scanning-10 Mikroskope) benötigt, welche einen hohen Durchsatz aufweisen (d.h. in kurzer Zeit eine große Menge an Objekten optisch erfassen können) und große Flächen, beispielsweise in der Größenordnung von bis zu 20 cm x 20 cm, bei einer typischen Bildauflösung von etwa l µm bildmäßig erfassen können. Für bestimmte Applikationen sollen außerdem Tiefenprofile des optisch abzutastenden Objekts erstellt werden können.

Ein derartiges Abtastmikroskop ist üblicherweise mit einer Bild-erzeugenden Scannerkamera ausgerüstet, deren Bildpunkte als integrierte Schaltung (Chip) in CMOS-Technologie hergestellt sind und welche in der Bildebene des Mikroskops angeordnet ist. Ein Objektivlinsensystem in dem Mikroskop erlaubt verschiedene, für die Mikroskopie typische Vergrößerungen von Objektbildern in der Objektebene, beispielsweise 10-fach, 20-fach, 50-fach, 100-fach, usw.

Für das optische Abtasten ("Scannen") eines Objekts wird üblicherweise ein Kreuz-Verschiebetisch computergesteuert horizontal bewegt, wobei die beiden Grundrichtungen dieser horizontalen Bewegung üblicherweise als "x-Richtung" und als "y-Richtung" bezeichnet werden. Die Bewegung in "z-Richtung", d.h. die vertikale Bewegung und damit die Fokussierung des Mikroskops, wird mittels einer computergesteuerten Linearführung des Objektivlinsensystems gewährleistet. In Abhängigkeit von der Vergrößerung und den Spezifikationen des Objektivlinsensystems ist die Größe eines typischen Sichtfeldes ("field of view") eines derartigen Mikroskops etwa 200 μm x 200 μm, welches in der Bildebene auf den

PCT/DE2005/001516

2

fotoempfindlichen (z.B. CMOS) -Bildaufnahmechip der Scannerkamera vollständig abgebildet wird. Als Scannerkamera wird heutzutage eine Farbkamera mit einer Auflösung von mehr als ab 1 Mpixel verwendet.

5

10

15

Bei einer optisch abzutastenden Fläche von 10 cm x 10 cm werden somit von der Scannerkamera etwa 250.000 Einzelbilder erzeugt. Diese Zahl muss unter Umständen noch mit der Zahl der Tiefenprofilbilder multipliziert werden. Die schrittweise aufgenommenen, "nebeneinander liegenden" Einzelbilder einer jeden Ebene können dann durch sogenanntes "softwarestitching" zu einem oder mehreren Gesamtbildern zusammengefügt werden. Die nachfolgende Analyse der Gesamtbilder kann computergesteuert automatisch geschehen und ist applikationsabhängig.

Die elektronische Erfassung derartig großer Datenmengen sowie die gleichzeitige Bildverarbeitung bzw. Bildspeicherung in Echtzeit ist weitgehend unproblematisch und derzeitig mit etwa 10 - 100 Bildern pro Sekunde ("frames per second" - fps) bei voller Bildgröße realisiert. Zukünftige Entwicklungen werden diesen Wert vermutlich noch einmal um einen Faktor 10 steigern können. Wird nun eine Bildverarbeitungsrate von 100 fps zu Grunde gelegt, so ist eine vollständige mikroskopische Bilderfassung der Fläche im oben angegebenen Beispiel von 100 cm² elektronisch in etwa 40 Minuten möglich. Sollen nur Teile der Fläche mikroskopisch erfasst werden (z.B. eine Anordnung von Objektträgern oder eine Proben-Matrix), reduziert sich diese Zahl entsprechend.

30

35

Problematisch ist jedoch die mechanische Realisierung der Bewegungsvorgänge, da für die Aufnahme eines Bildes das Objekt immer in eine Ruheposition gebracht werden muss. Die Mechanik eines handelsüblichen Kreuz-Verschiebetisches ist aber nicht in der Lage, eine derart hohe Zahl von Start-Vorgängen (Beschleunigungen) und Stopp-Vorgängen (Abbremsungen), gemäß oben beschriebenem Beispiel 100 Start-/

3

PCT/DE2005/001516

Stopp-Vorgänge pro Sekunde, bei gleichzeitig geringem Hub (ca. 200 μ m) durchzuführen.

Hinzu kommt eine zusätzlich auftretende Instabilität des mechanischen Systems des Abtastmikroskops auf Grund nicht vermeidbarer erheblicher mechanischer Schwingungen, welche von den in kurzer Zeit auftretenden Start-/Stopp-Vorgängen verursacht werden. Die Zahl der Start-/Stopp-Vorgänge im Dauerbetrieb ist daher auf etwa 1 - 3 pro Sekunde begrenzt.

- Notwendige längere Verfahrwege, wie beispielsweise beim Wiederauffinden bestimmter Positionen, beim Anfahren von Objektträgern oder bei Mehrfachproben sind für die Zeitbilanz eines Abtast-Vorgangs unerheblich.
- Der Erfindung liegt somit das Problem zugrunde, eine Scanneranordnung, z.B. zum Einsatz in einem Scanning-Mikroskop, sowie ein Verfahren zum optischen Abtasten eines Objekts anzugeben, bei der/dem ein Objekt, welches eine optisch abzutastende Fläche in der Größenordnung von 100 cm² aufweist, mit einer Bildverarbeitungsrate von 100 fps und darüber unter Vermeidung der aus dem Stand der Technik bekannten mechanischen Schwingungen einfach optisch abgetastet werden kann.
- Eine erfindungsgemäße Scanneranordnung, insbesondere ein Scanning-Mikroskop, zum optischen Abtasten eines Objekts in einer Folge von Abtastschritten, weist auf einen antreibbaren, bewegbaren Objekttisch und ein Scannerobjektiv, welches eine Frontobjektivlinse an einem
- Objektivlinsenschlitten aufweist, welcher von einem Schlittenantrieb parallel zu dem Objekttisch bewegbar ist, wobei der Objekttisch für eine durchgehend kontinuierliche Bewegung während der Folge von Abtastschritten antreibbar ist und der Objektivlinsenschlitten mit der Frontobjektivlinse in
- jedem der Abtastschritte für einen Vorbewegungsschritt, in welchem die Frontobjektivlinse aus einer Ausgangsstellung heraus synchron mit dem Objekttisch mitbewegt wird, und jeweils zwischen aufeinander folgenden Abtastschritten für

4

eine Rückbewegung in die Ausgangsstellung antreibbar ist, wobei das optische Abtasten des Objekts während der kontinuierlichen Bewegung des Objekttischs durchführbar ist.

Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zum optischen Abtasten eines Objekts in einer Folge von Abtastschritten mittels einer Scanneranordnung, insbesondere eines Scanning-Mikroskops, welche ein Scannerobjektiv mit einer Frontobjektivlinse aufweist, werden die Abtastschritte während der kontinuierlichen Bewegung des Objekts durchgeführt, indem die Frontobjektivlinse des Scannerobjektivs während jedes der Abtastschritte aus einer Ausgangsposition heraus synchron mit dem Objekt mitbewegt wird und jeweils zwischen den Abtastschritten in die Ausgangsstellung zurückbewegt wird.

Anschaulich befindet sich bei sich bewegendem Objekt die Frontobjektivlinse des Scannerobjektivs während jedes der Abtastschritte, d.h. während der Aufnahme eines Abbildes des sichtbaren Objektausschnitts mittels einer an das Scannerobjektiv optisch gekoppelten Scannerkamera, relativ zum sich bewegenden Objekt erfindungsgemäß "in Ruhe", da der Objektivlinsenschlitten mit der daran befestigten Frontobjektivlinse mit dem sich bewegenden Objekt gleichförmig und synchron, d.h. in gleicher Richtung und mit gleicher Geschwindigkeit, mitbewegt wird.

Auf Grund des Rückbewegens der Frontobjektivlinse in ihre Ausgangsposition zwischen zwei aufeinander folgenden Abtastschritten startet die Frontobjektivlinse somit bei jedem nachfolgenden Abtastschritt stets von der gleichen Stelle aus.

Der Antrieb des Objekttischs, der Schlittenantrieb sowie der 35 Auslöse- und Blendenmechanismus der Scannerkamera werden mittels einer geeigneten Steuerung, beispielsweise mittels eines Steuercomputers, angetrieben, welche das Zusammenspiel der Vorbewegung des Objekts mittels des Objekttischs, der

PCT/DE2005/001516

5

Vor- und Rückbewegung der Frontobjektivlinse an dem Objektivlinsenschlitten mittels des Schlittenantriebs sowie der Bildaufnahme der Scannerkamera mittels des Auslöse- und Blendenmechanismus steuert.

5

10

20

25

30

Ein Vorteil der Erfindung ist darin zu sehen, dass mittels des Mitbewegens der Frontobjektivlinse des Scannerobjektivs mit dem Objekt während jedes der Abtastschritte die hohe Anzahl der aus dem Stand der Technik bekannten Start-/Stopp-Vorgänge des Objekttisches (üblicherweise ein Kreuz-Verschiebetisch) vermieden wird. Daraus resultiert erfindungsgemäß im Vergleich zum Stand der Technik eine erheblich verbesserte Stabilität der gesamten Scanneranordnung, was eine erheblich höhere

15 Bildaufnahmefrequenz ermöglicht.

Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist, dass der zum Antreiben des Objekttisches verwendete Motor im Vergleich zum Stand der Technik auf Grund der erheblich reduzierten Start-/Stopp-Vorgänge einen deutlich geringeren Verschleiß aufweist. Somit wird erfindungsgemäß die Lebensdauer des Objekttisches und diesbezüglich folglich auch der gesamten Scanneranordnung erhöht. Außerdem reicht als Antrieb für den Objekttisch ein einfacher und damit billiger, und sich erfindungsgemäß mit konstanter Geschwindigkeit bewegender Linearmotor aus.

Noch ein weiterer Vorteil der Erfindung ist darin zu sehen, dass die für das optische Abtasten ("Scannen") des Objekts benötigte Zeit kürzer ist als im Stand der Technik, da die Erfindung auf die zeitaufwändigen Start-/Stopp-Vorgänge verzichtet. Insbesondere kann im Vergleich zum Stand der Technik die Bildaufnahmerate um einen Faktor 30 bis 100 erhöht werden.

Vorzugsweise weist der Schlittenantrieb eine
Vorbewegungsvorrichtung mit einem Piezo-Element auf. Die
Vorbewegungsvorrichtung dient dabei dem Verschieben der
Frontobjektivlinse an dem Objektivlinsenschlitten parallel zu

6

und in gleicher Geschwindigkeit und Richtung mit dem Objekt aus ihrer Ausgangsposition in eine Endposition während der Abtastvorgänge. Das Piezo-Element weist bevorzugt einen maximalen Hub auf, welcher im Bereich zwischen 100 µm und 1 mm liegt und insbesondere 500 µm beträgt. Außerdem ist das Piezo-Element vorzugsweise mit einer Frequenz im Bereich von zwischen 10 Hz und 200 Hz, insbesondere mit einer Frequenz von 100 Hz, betreibbar.

- Der Schlittenantrieb weist bevorzugt eine
 Rückbewegungsvorrichtung mit einem Permanentmagneten auf. Die
 Rückbewegungsvorrichtung dient dabei dem Verschieben der
 Frontobjektivlinse an dem Objektivlinsenschlitten aus ihrer
 Endposition in ihre Ausgangsposition zwischen den
- Abtastschritten. Insbesondere werden als bevorzugte
 Weiterbildung zur Rückbewegungsvorrichtung zwei
 Permanentmagnete verwendet. Der eine Permanentmagnet ist dazu
 an dem Objektivlinsenschlitten des Scannerobjektivs
 angebracht und der zweite Permanentmagnet ist an einem
- separaten Halter der Scanneranordnung angebracht, wobei sich die beiden Permanentmagnete auf Grund der Anordnung ihrer Magnetpole und der dadurch erzeugten Magnetkraft gegenseitig abstoßen.
- Sobald an dem Piezo-Element der Vorbewegungsvorrichtung eine Spannung anliegt, verschiebt es den Objektivlinsenschlitten und damit die Frontobjektivlinse von ihrer Ausgangsposition aus in Richtung entgegen der von den beiden Permanentmagneten der Rückbewegungsvorrichtung ausgehenden Magnetkraft. Auf Grund der Magnetkraft wird die an dem Objektivlinsenschlitten
- Grund der Magnetkraft wird die an dem Objektivlinsenschlitten angebrachte Frontobjektivlinse nach dem Spannungsfrei-Schalten des Piezo-Elements wieder in ihre Ausgangsposition verschoben.
- In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung weist die Frontobjektivlinse einen Linsen-Sichtbereich auf dem Objekt und das Scannerobjektiv einen Objektiv-Sichtbereich auf dem Objekt auf. Der Linsen-Sichtbereich ist vorzugsweise größer

30

35

7

als der Objektiv-Sichtbereich. Der jeweilige Sichtbereich auf dem Objekt ergibt sich dabei aus dem Sichtfeld der jeweiligen optischen Komponente(n). Insbesondere ist der Durchmesser der Frontobjektivlinse größer als der Durchmesser des Objektiv-Sichtfeldes am Ort der Frontobjektivlinse. Dabei ist die Abweichung der Frontobjektivlinse von der optischen Achse des Scannerobjektivs während des Vorbewegungsschritts immer noch derart klein, dass in der Bildebene auf dem Bildaufnahmechip

der Scannerkamera keine erkennbaren zusätzlichen

10 Abbildungsfehler entstehen.

In noch einer bevorzugten Weiterbildung der erfindungsgemäßen Scanneranordnung weist diese ein an dem Scannerobjektiv angebrachtes zusätzliches Piezo-Elemente auf, welches derart angebracht ist, dass das Scannerobjektiv entlang seiner optischen Achse verstellbar ist, so dass der Fokus des Scannerobjektivs einstellbar ist. Dadurch kann ein Tiefenprofil des Objekts aufgenommen werden. Diese Einstellung des Fokus kann beispielsweise während des Mitbewegens der Frontobjektivlinse mit dem Objekt von der Ausgangsposition in die Endposition der Frontobjektivlinse erfolgen.

Die Scannerkamera weist bevorzugt einen Bildaufnahmechip auf, 25 welcher in CMOS-Technologie hergestellt ist.

Die als Scanning-Mikroskop verwendete Scanneranordnung ist insbesondere für den Einsatz in den Bereichen Bildarchivierung, Biologie, Biophysik, Pharmakologie, Materialkontrolle und Medizin histologischer Präparate vorgesehen.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Figuren schematisch dargestellt und wird im Folgenden näher erläutert. Dabei bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche Komponenten.

Es zeigen

15

- Figur 1 eine schematische Darstellung des Prinzips der
 Bildaufnahme gemäß einem Ausführungsbeispiel der
 Erfindung;
- 5 Figur 2 eine Querschnittsansicht einer Scanneranordnung gemäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung;
 - Figur 3 eine perspektivische Explosionsansicht der Scanneranordnung gemäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung;
- 10 Figur 4 eine Seitenansicht der Scanneranordnung gemäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung; und
 - Figur 5 eine bildliche Wiedergabe eines Objektes, welches aus mehreren mittels der Scanneranordnung gemäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung aufgenommenen Abbildungen zusammengesetzt wurde.
 - Fig.1 zeigt eine schematische Darstellung des Prinzips der Bildaufnahme gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.
- Mit Bezugszeichen 100 wird ein abzutastendes Objekt 101 in einer ersten Position dargestellt, welches sich in Richtung des Pfeils A mit konstanter Geschwindigkeit kontinuierlich bewegt. Das Objekt 101 weist mehrere gleichartige Linsen-Sichtbereiche 102 auf, welche schrittweise nacheinander
- 25 mittels einer Scannerkamera (nicht dargestellt) durch ein Scannerobjektiv hindurch aufgenommen werden sollen. Dabei entspricht die Querschnittsfläche der Linsen-Sichtbereiche 102 auf dem Objekt 101 dem Querschnitt des Sehfelds ("field of view") einer Frontobjektivlinse 103 auf dem Objekt 101.
- Die Frontobjektivlinse 103 ist Teil des Scannerobjektivs, welche in diesem Ausführungsbeispiel eine Einzellinse mit einem Durchmesser von ca 5 mm aufweist. Die Scannerkamera weist ein Kamera-Sehfeld auf, dessen Querschnitt auf dem Objekt 101 als Kamera-Sichtbereich 104 bezeichnet wird,
- 35 dessen Größe abhängig vom Objektiv ist. Der Linsen-Sehbereich

9

102 (FoV) der Frontobjektivlinse 103 ist in Position 100 linksbündig mit dem Kamera-Sehbereich 104 dargestellt.

Während der Aufnahme eines Abbildes des Objekts 101 mittels der Scannerkamera, d.h. während eines Abtastschritts, wird zusätzlich zu dem sich bewegenden Objekt 101 auch die Frontobjektivlinse 103 bewegt. Die Bewegung der Frontobjektivlinse 103 wird gemäß dem Ausführungsbeispiel mittels eines Piezo-Kristalls bewerkstelligt, welcher die 10 Frontobjektivlinse 103 um bis zu 500 µm verschieben kann, und wird durch den Pfeil B angedeutet. Dabei wird die Frontobjektivlinse 103 um die gleiche Wegstrecke, mit der gleichen Geschwindigkeit und in die gleiche Richtung wie das Objekt 101 bewegt, d.h. die Bewegung der Frontobjektivlinse 103 ist an die Bewegung des Objekts 101 angepasst. Diese 15 Anpassung der Bewegung der Frontobjektivlinse 103 an die Bewegung des Objekts 101 erfolgt mittels einer geeigneten Steuerung, beispielsweise einem Steuercomputer. Anschaulich befindet sich die Frontobjektivlinse 103 während des Abtastschritts bezüglich des Objekts 101 "in Ruhe", d.h. die 20 Scannerkamera nimmt ein "stehendes Bild" auf.

Am Ende des jeweiligen Abtastschritts befindet sich die Frontobjektivlinse 103 in der mit Bezugszeichen 200 bezeichneten Endposition, in welcher der Linsen-Sehbereich 25 102 der Frontobjektivlinse 103 rechtsbündig mit dem Kamera-Sehbereich 104 dargestellt ist. Vor Beginn des nachfolgenden Abtastschritts wird nun ausschließlich die Frontobjektivlinse 103 wieder in ihre Ausgangsposition zurückbewegt, das Objekt 101 hingegen wird in Richtung des Pfeils A weiterbewegt. Das 30 Zurückbewegen der Frontobjektivlinse 103 erfolgt gemäß dem Ausführungsbeispiel mittels geeignet angebrachter Permanentmagnete (Details hierzu sind in den nachfolgenden Figuren beschrieben). Die zurückbewegte Frontobjektivlinse 103 ist in Position 300 dargestellt. Position 300 gleicht der Position 100 mit Ausnahme des um einen Linsen-Sehbereich 102 (FoV) in Richtung Pfeil A verschobenen Objekts 101.

10

Während des nächstfolgenden Abtastschritts werden nun wieder sowohl das Objekt 101 als auch die Frontobjektivlinse 103 in Richtung Pfeil A bzw. B verschoben. Am Ende des nächstfolgenden Abtastschritts befinden sich das Objekt 101 und die Frontobjektivlinse 103 in Position 400, welche der Position 200 mit Ausnahme des um einen Linsen-Sehbereich 102 in Richtung Pfeil A verschobenen Objekts 101 gleicht. Anschließend wird die Frontobjektivlinse 103 wieder in ihre Anfangsposition zurückbewegt, wonach sich das System in der 10 mit Bezugszeichen 500 bezeichneten Position befindet. Position 500 gleicht der Position 100 mit Ausnahme des um zwei Linsen-Sehbereiche 102 in Richtung Pfeil A verschobenen Objekts 101.

15 Im Folgenden wird nun eine als Scanning-Mikroskop vorgesehene Scanneranordnung 50 gemäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung im Detail beschrieben.

Fig.2 stellt eine Querschnittsansicht der Scanneranordnung 50 dar.

Die Scanneranordnung 50 weist einen Halter 1 auf, an dessen oberem Ende eine herkömmliche Scannerkamera (nicht dargestellt und nicht näher beschrieben) angebracht ist. Die 25 Scannerkamera ist ortsfest und bleibt daher beim optischen Abtasten eines Objekts still stehen, d.h. das Objekt wird an der Scannerkamera vorbei bewegt. An dem Halter 1 ist mittig unterhalb der Scannerkamera ein piezo-gesteuerter Objektivhalter 3 befestigt, an dessen Unterseite ein 30 Scannerobjektiv 4, 7-10 (in Fig.3) befestigt ist. Der piezogesteuerte Objektivhalter 3 dient dem Einstellen des genauen Fokuspunktes des Scannerobjektivs 4, 7-10 (in Fig.3), d.h. dem Verstellen der Position des Scannerobjektivs 4, 7-10 (in Fig. 3) entlang der optischen Achse des Scannerobjektivs 4, 35 7-10 (in Fig. 3) relativ zur Scannerkamera. Gemäß diesem Ausführungsbeispiel wird als piezo-gesteuerter Objektivhalter 3 das Modell Pifoc P-725.4CD verwendet.

Das Scannerobjektiv 4, 7-10 (vgl Fig. 3) weist ein am piezogesteuerten Objektivhalter 3 befestigtes, ebenso wie die Scannerkamera ortsfestes Objektivoberteil 4 und ein verschiebbares Objektivunterteil 7-10 (in Fig. 3) auf. Das Objektivoberteil 4 weist gemäß dem Ausführungsbeispiel eine einschraubbare Streulichtschutzblende, zwei Minirail-Befestigungseinfräsungen und einen Arretierungsring auf. Außerdem ist das Objektivoberteil 4 mit der Scannerkamera optisch gekoppelt. Das Objektivunterteil 7-10 weist mit den zwei Minirail-Befestigungseinfräsungen im Eingriff stehende 10 Minirail-Führungen 7 (vgl. Fig.3), gemäß dem Ausführungsbeispiel zweimal Modell MDN-05-10-05, einen Objektivlinsenschlitten 8, welcher auch Linsenführungsteller genannt wird und ein Einschraubgewinde für einen Frontlinsenhalter, einen Permanentmagnethalter sowie ein 15 teflonbeschichtetes Gleitlager für eine Druckplatte 6 aufweist, einen einschraubbaren Frontlinsenhalter 9 mit Frontlinsendeckelschraube und einen in den Permanentmagnethalter an dem Objektivlinsenschlitten 8 eingebauten Permanentmagneten 10 auf. 20

An dem Halter 1 ist links und rechts neben dem Scannerobjektiv 4, 7-10 (vgl. Fig. 3) jeweils ein Befestigungswinkel 2, 12 angebracht. An der Unterseite des rechten Befestigungswinkels 2 sind ein mittels eines Piezo-25 Elements angetriebener Verschiebetisch 5, gemäß dem Ausführungsbeispiel ein Hera-Piezo-Tisch Modell P-625.1CD, und darunter eine Druckplatte 6 angebracht. Die Druckplatte 6 wird mittels des Verschiebetisches 5 parallel zur Bewegungsrichtung des mittels eines Objekttisches 30 verschobenen, optisch abzutastenden Objekts in Richtung des linken Befestigungswinkels 12 verschoben. Da die Druckplatte 6 an dem Objektivlinsenschlitten 8 anliegt, wird beim Bewegen der Druckplatte 6 gleichzeitig der Objektivlinsenschlitten 8 in die gleiche Richtung bewegt. Diese Bewegung wird durch die 35 Minirail-Führungen 7 (vgl Fig. 3) entsprechend unterstützt.

12

PCT/DE2005/001516

An der Unterseite des linken Befestigungswinkels 12 ist eine verstellbare Führung angebracht, an welcher ihrerseits ein Permanentmagnet 11 befestigt ist. Die verstellbare Führung dient der genauen Positionierung des Permanentmagneten 11, welcher auch als Permanentmagnetstempel bezeichnet werden kann, in Bezug auf den Permanentmagneten 10 am Objektivlinsenschlitten 8. Dabei ist es wichtig, auf die richtige Anordnung der Pole der beiden Permanentmagnete 10 und 11 zu achten: Da die Druckplatte 6 den

- Objektivlinsenschlitten 8 auf Grund des mittels Piezo-Element (genauer: piezo-elektrischem Element) angetriebenen Verschiebetisches 5 beim Anliegen einer Spannung an dem zugehörigen Piezo-Kristall in Richtung zu dem linken Befestigungswinkel 12 hin verschiebt, müssen die beiden
- Permanentmagnete 10, 11 sich magnetisch abstoßend montiert sein, um den Objektivlinsenschlitten 8 bei spannungsfreiem Piezo-Kristall in die Ausgangsposition zurückzubewegen.

Die Scanneranordnung 50, von den Erfindern AMBIS-System (Anti 20 Motion-Blurring Imaging Scanning System = gegen die Erzeugung von Bewegungsunschärfe wirkendes Bilderfassungssystem) genannt, erlaubt es, die aus dem Stand der Technik bekannten mechanischen Start-/Stopp-Vorgänge in einem Mikroskopsystem vollständig zu umgehen. Dies wird durch den Einsatz eines piezo-elektrischen Elements mit langem Hub gewährleistet. Ein 25 derartiges piezo-elektrisches Element bewegt nur noch das wenige Gramm schwere Objektivunterteil 7-10 mit der Frontobjektivlinse und dem Objektivlinsenschlitten 8. Der Objekttisch kann in der y-Richtung, d.h. vom rechten 30 Befestigungswinkel 2 aus gesehen in Richtung linker Befestigungswinkel 12, mit konstanter Geschwindigkeit unter der Frontobjektivlinse hinweg bewegt werden. Das Piezo-

Frontobjektivlinse und dem Objektivlinsenschlitten 8 in die gleiche Richtung und mit gleicher Geschwindigkeit wie das Objekt synchron mitbewegt, so dass für die Zeit der Aufnahme eines Teilbilds des Objekts, d.h. während eines

Element kompensiert die Bewegung des Objekttischs in der

Weise, dass es das Objektivunterteil 7-10 mit der

13

WO 2006/024279 PCT/DE2005/001516

Abtastschritts, für die Scannerkamera ein "stehendes Bild" entsteht.

Werden bei diesem Ausführungsbeispiel eine Bildaufnahmerate von 100 fps sowie ein Sichtfeld von 200 μ m x 200 μ m auf dem Objekt zu Grunde gelegt, so können bei einer Bewegung des Objekttisches mit einer Geschwindigkeit von 2 cm/s alle Abtastschritte nahtlos aneinandergefügt werden.

10 Das in diesem Ausführungsbeispiel für die horizontale Verschiebung des Objektivunterteils 7-10 verwendete Piezo-Element ist mit einem maximalen Hub von 500 µm spezifiziert und kann bis zu einer Frequenz von 100 Hz durchlaufen werden. Nach Erreichen des gewünschten Hubs, welcher in Abhängigkeit 15 von der jeweiligen Applikation der Breite eines Linsen-Sichtbereichs auf dem Objekt entspricht, wird das Objektivunterteil 7-10 mit der Frontobjektivlinse und dem Objektivlinsenschlitten 8 durch Abschalten der Piezo-Spannung und unterstützt durch die gleich gepolten Magnetfelder der 20 beiden Permanentmagnete 10, 11 in die ursprüngliche Position zurückgeführt. Dieser Zurückführungs-Prozess dauert weniger als 5 ms.

Die Bewegung des Piezo-Kristalls des Verschiebetisches 5 ist über ein elektronisches Feed-back-System mit der Bewegung der y-Achse des Objekttisches gekoppelt. Damit entsteht über einen Verfahrbereich von 500 µm (oder über einen Zeitraum von 25 ms unter Anwendung des obigen Geschwindigkeitswerts von 2 cm/s) der Eindruck eines "stehenden Bildes". Diese Zeit ist deutlich länger als die elektronische Blenden-Öffnungszeit der Scannerkamera. Die Abweichung der Frontobjektivlinse von der optischen Achse der Scanneranordnung 50 des Abtastmikroskops ist während des Bewegungsvorgangs immer noch derart klein, dass in der Bildebene auf der Scannerkamera keine erkennbaren zusätzlichen Abbildungsfehler entstehen.

Das oben erwähnte elektronische Feed-back-System steuert in Abhängigkeit von der Bewegung der y-Achse des Objekttisches

14

WO 2006/024279 PCT/DE2005/001516

neben der Bewegung des Piezo-Kristalls des Verschiebetisches 5 auch die Blendenöffnung der Scannerkamera. Als elektronisches Feed-back-System kann ein handelüblicher Steuercomputer verwendet werden.

5

Die Bewegung des gesamten Objektivunterteils 7-10 in zRichtung (d.h. entlang der optischen Achse des
Scannerobjektivs 4, 7-10 bzw. senkrecht zur Verschiebeebene
des Objekts) kann in gleicher Weise mittels mindestens einem
10 Piezo-Element gesteuert werden. Dadurch ist eine
gleichzeitige Aufnahme eines Tiefenprofils des optisch
abzutastenden Objekts (oder auch eine mögliche
Nachfokussierung der Scanneranordnung 50) während der Phase
des "stehenden Bildes", d.h. während eines Abtastschritts,
ebenfalls möglich.

Fig.3 zeigt nun eine perspektivische Explosionsansicht der Scanneranordnung 50 gemäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung. In Fig.2 bereits beschriebene Teile werden nicht erneut beschrieben.

In dieser Darstellung der Scanneranordnung 50 sind nun auch die Minirail-Führungen 7, welche mit den Minirail-Befestigungseinfräsungen im Eingriff stehen, deutlich sichtbar. Diese Minirail-Führungen 7 gewährleisten, dass der Objektivlinsenschlitten 8 bei seiner Bewegung parallel zu dem Objekttisch über das abzutastende Objekt hinweg bezüglich des Objekttischs in vorgegebenem konstantem Abstand gehalten wird.

30

25

20

In **Fig.4** ist eine Seitenansicht der Scanneranordnung 50 gemäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt. In Fig.2 bereits beschriebene Teile werden nicht erneut beschrieben.

Zusätzlich zu der Scanneranordnung 50 ist in Fig.4 ein abzutastendes Objekt 101 dargestellt, welches zum Verschieben auf einem Objekttisch 40 positioniert ist. Während das Objekt 101 mittels des Objekttisches 40 kontinuierlich in Richtung

15

des Pfeils A verschoben wird sowie während jedes der Abtastschritte verschiebt der mittels Piezo-Element angetriebene Verschiebetisch 5 auch die Frontobjektivlinse in Richtung des Pfeils A, wobei die Kraft des Verschiebetisches 5 mittels der Druckplatte 6 auf den Objektivlinsenschlitten 8 übertragen wird, an welchem schließlich die zu bewegende Frontobjektivlinse befestigt ist.

Fig.5 stellt schließlich eine bildliche Wiedergabe 60 eines
10 Objektes dar, welches aus mehreren mittels der
Scanneranordnung 50 gemäß dem Ausführungsbeispiel der
Erfindung aufgenommenen Teilbildern zusammengesetzt wurde.

Als Objekt wurde in diesem Ausführungsbeispiel der Querschnitt eines Wurzelstocks eines Maiglöckchens verwendet. Die Skala der bildlichen Wiedergabe 60 (siehe links unten in Fig.5) beträgt 654,30 μ m. Mit der verwendeten Scanneranordnung 50 konnte für die bildliche Wiedergabe 60 eine Auflösung von zwischen 1 μ m und 2 μ m erzielt werden.

20

25

Da die in der Scanneranordnung 50 verwendete Scannerkamera an einen Computer zum Bildauslesen, zur Bildverarbeitung und zur Bildspeicherung angeschlossen ist, können nach Belieben bestimmte Bereiche der in Fig.5 dargestellten bildlichen Wiedergabe 60 des optisch abgetasteten Objekts per Software auch noch vergrößert dargestellt werden.

Patentansprüche

WO 2006/024279

- Scanneranordnung (50), insbesondere Scanning-Mikroskop, zum optischen Abtasten eines Objekts (101) in einer Folge von Abtastschritten, mit einem antreibbaren, bewegbaren 5 Objekttisch (40) und einem Scannerobjektiv (4, 7-10), welches eine Frontobjektivlinse (9, 103) an einem Objektivlinsenschlitten (8) aufweist, welcher von einem Schlittenantrieb (5, 6, 10, 11) parallel zu dem Objekttisch (40) bewegbar ist, wobei der Objekttisch (40) 10 für eine durchgehend kontinuierliche Bewegung während der Folge von Abtastschritten antreibbar ist und der Objektivlinsenschlitten (8) mit der Frontobjektivlinse (9, 103) in jedem der Abtastschritte für einen Vorbewegungsschritt, in welchem die Frontobjektivlinse 15 (9, 103) aus einer Ausgangsstellung heraus synchron mit dem Objekttisch (40) mitbewegt wird, und jeweils zwischen aufeinander folgenden Abtastschritten für eine Rückbewegung in die Ausgangsstellung antreibbar ist, wobei das optische Abtasten des Objekts (101) während der 20 kontinuierlichen Bewegung des Objekttischs (40) durchführbar ist.
- Scanneranordnung (50) gemäß Anspruch 1,
 bei welcher der Schlittenantrieb (5, 6, 10, 11) eine Vorbewegungsvorrichtung (5, 6) mit einem Piezo-Element aufweist.
- 3. Scanneranordnung (50) gemäß Anspruch 1 oder 2,

 bei welcher der Schlittenantrieb (5, 6, 10, 11) eine
 Rückbewegungsvorrichtung (10, 11) mit einem
 Permanentmagneten aufweist.
- Scanneranordnung (50) gemäß Anspruch 2,
 bei welcher das Piezo-Element einen maximalen Hub aufweist, welcher im Bereich zwischen 100 μm und 1 mm liegt und insbesondere 500 μm beträgt.

17

5. Scanneranordnung (50) gemäß Anspruch 2 oder 4, bei welcher das Piezo-Element mit einer Frequenz im Bereich von zwischen 5 Hz und 200 Hz, insbesondere mit einer Frequenz von zwischen 25 und 120 Hz, betreibbar ist.

5

35

- 6. Scanneranordnung (50) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, bei welcher die Frontobjektivlinse (9, 103) einen Linsen-Sichtbereich (102) auf dem Objekt (101) aufweist und bei welcher das Scannerobjektiv (4, 7-10) einen Objektiv-Sichtbereich (104) auf dem Objekt (101) aufweist, wobei der Linsen-Sichtbereich (102) größer als der Objektiv-Sichtbereich (104) ist.
- 7. Scanneranordnung (50) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, mit einem an dem Scannerobjektiv (4, 7-10) angebrachten zusätzlichen Piezo-Element (3), welches derart angebracht ist, dass das Scannerobjektiv (4, 7-10) entlang seiner optischen Achse verstellbar ist, so dass der Fokus des Scannerobjektivs (4, 7-10) zum Aufnehmen eines Tiefenprofils des Objekts (101) einstellbar ist.
- 8. Verfahren zum optischen Abtasten eines Objekts (101) in einer Folge von Abtastschritten mittels einer

 25 Scanneranordnung (50), insbesondere eines ScanningMikroskops, welche ein Scannerobjektiv (4, 7-10) mit einer Frontobjektivlinse (9, 103) aufweist, bei dem die Abtastschritte während der kontinuierlichen Bewegung des Objekts (101) durchgeführt werden, indem die

 Frontobjektivlinse (9, 103) des Scannerobjektivs (4, 7-10) während indem der Abtastschritte aus einer
 - 10) während jedes der Abtastschritte aus einer
 Ausgangsposition heraus synchron mit dem Objekt (101)
 mitbewegt wird und jeweils zwischen den Abtastschritten
 in die Ausgangsstellung zurückbewegt wird.

9. Verfahren gemäß Anspruch 8, bei welchem das Mitbewegen der Frontobjektivlinse (9,

18

103) während der Abtastschritte mittels eines Piezo-Elements erfolgt.

- 10. Verfahren gemäß Anspruch 8 oder 9,

 bei welchem das Zurückbewegen der Frontobjektivlinse (9,

 103) zwischen den Abtastschritten mittels eines

 Permanentmagneten (10) erfolgt.
- 11. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 8 bis 10,

 bei welchem ein derartiges Scannerobjektiv (4, 7-10) mit
 Objektiv-Sichtbereich (104) und eine derartige
 Frontobjektivlinse (9, 103) mit Linsen-Sichtbereich (102)
 verwendet werden, dass der Objektiv-Sichtbereich (104)
 auf dem Objekt (101) größer als der Linsen-Sichtbereich
 (102) auf dem Objekt (101) ist.
- 12. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 8 bis 11,
 bei welchem ein an dem Scannerobjektiv (4, 7-10)
 angebrachtes zusätzliches Piezo-Element (3) verwendet

 20 wird, um das Scannerobjektiv (4, 7-10) entlang seiner
 optischen Achse derart verstellen zu können, dass der
 Fokus des Scannerobjektivs (4, 7-10) zum Aufnehmen eines
 Tiefenprofils des Objekts (101) während des Mitbewegens
 der Frontobjektivlinse (9, 103) mit dem Objekt (101)
 eingestellt werden kann.

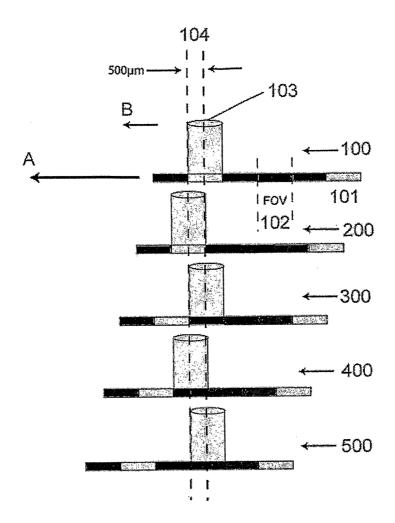


Fig.1

1/5

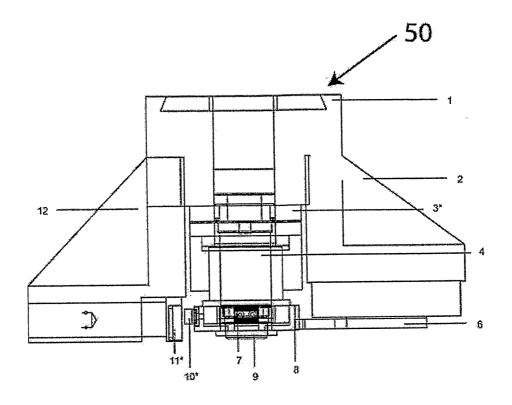
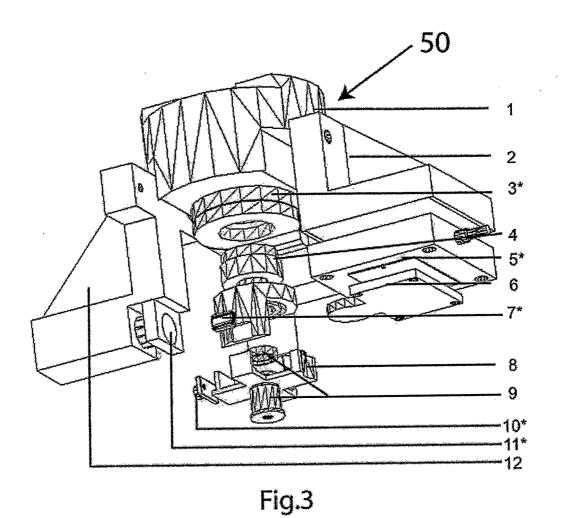


Fig. 2

2/5



3/5

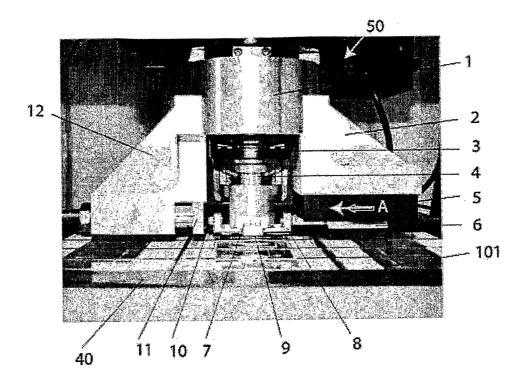


Fig.4

4/5

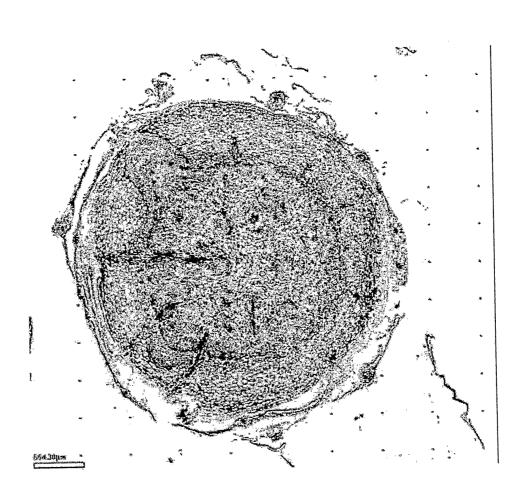


Fig.5

5/5



International application No
PCT/DE2005/001516

A CONTRACTOR OF OUR PROTECTION				
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER G02B21/36 G02B21/26				
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	ation and IPC		
	SEARCHED			
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed by classification $602B$	on symbols)		
i i	tion searched other than minimum documentation to the extent that s		-	
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical, search terms used)	
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, INSPEC			
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	levant passages	Relevant to claim No.	
А	US 2002/089740 A1 (WETZEL ARTHUR 11 July 2002 (2002-07-11) paragraphs '0009! - '0011! paragraphs '0014! - '0016! figure 1	1–12		
A	US 5 912 699 A (HAYENGA ET AL) 15 June 1999 (1999-06-15) column 1, lines 27-34 column 5, lines 46-55 figure 1	1-12		
А	EP 0 557 558 A (MITSUI MINING & S CO., LTD) 1 September 1993 (1993- column 3, lines 33-41 column 5, lines 17-23 figure 1	1–12		
<u> </u>	her documents are listed in the continuation of Box C.	X See patent family annex.		
<u> </u>		C Passin damin dimon.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention "Y" document of particular relevance; the claimed invention "Y" document of particular relevance; the claimed invention			the application but early underlying the claimed invention to be considered to be considered to be coment is taken alone	
"O" docume other r	n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	cannot be considered to involve an in document is combined with one or morents, such combination being obvior in the art.	ventive step when the ore other such docu-	
later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family				
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	arch report	
3	O January 2006	06/02/2006		
Name and r	mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Authorized officer		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Kloppenburg, M		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

rmation on patent family members

International application No PCT/DE2005/001516

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 2002089740	Αĺ	11-07-2002	WO	02056084 A1	18-07-2002
US 5912699	Α	15-06-1999	AU W0	3723993 A 9316439 A1	03-09-1993 19-08-1993
EP 0557558	Α	01-09-1993	US	5298963 A	29-03-1994

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (April 2005)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT E2005/001516

a. klassifizierung des anmeldungsgegenstandes G02B21/36 G02B21/26					
Nach der Int	ternationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und der IPC			
B. RECHER	RCHIERTE GEBIETE	-			
Recherchier	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo G02B	ole)			
Recherchier	te, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	oweit diese unter die recherchierten Gebiete	: fallen		
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evti. verwendete S	Suchbegriffe)		
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, INSPEC				
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
Α	US 2002/089740 A1 (WETZEL ARTHUR 11. Juli 2002 (2002-07-11) Absätze '0009! - '0011! Absätze '0014! - '0016! Abbildung 1	W ET AL)	1-12		
А	US 5 912 699 A (HAYENGA ET AL) 15. Juni 1999 (1999-06-15) Spalte 1, Zeilen 27-34 Spalte 5, Zeilen 46-55 Abbildung 1		1-12		
A	EP 0 557 558 A (MITSUI MINING & S CO., LTD) 1. September 1993 (1993 Spalte 3, Zeilen 33-41 Spalte 5, Zeilen 17-23 Abbildung 1		1–12		
Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen X Siehe Anhang Patentfamille					
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundeflegenden Theorie angegeben ist 'X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung					
"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft er- scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nllein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindur kann nlein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindur kann nlein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindur kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindur kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf					
ausgerunn) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach					
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts					
	0. Januar 2006	06/02/2006	and the second second		
Name und P	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter			
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Kloppenburg, M			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen PCT E2005/001516

Im Recherchenbericht geführtes Patentdokument	t	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2002089740	A 1	11-07-2002	WO	02056084 A1	18-07-2002
US 5912699	A	15-06-1999	AU WO	3723993 A 9316439 A1	03-09-1993 19-08-1993
EP 0557558	Α	01-09-1993	US	5298 9 63 A	29-03-1994